

## 埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例 新旧対照表

(傍線の部分は、改正部分)

## 第一条関係

改 正 後				改 正 前			
埼玉県産業技術総合センター条例				埼玉県産業技術総合センター条例			
第一条～第十八条 (略)				第一条～第十八条 (略)			
別表第一 (第十五条関係)				別表第一 (第十五条関係)			
一 試験研究機器				一 試験研究機器			
種類	名称	単位	金額	種類	名称	単位	金額
一～二(略)	(略)	(略)	(略)	一～二(略)	(略)	(略)	(略)
三 強度試 験機器	イ～ヌ (略) <u>(削る)</u>	(略)	(略)	三 強度試 験機器	イ～ヌ (略) <u>ル</u> 疲労試験機	(略)	(略)
四 (略)	(略)	(略)	(略)	四 (略)	(略)	(略)	(略)
五 測定機 器	イ～タ (略) <u>(削る)</u>	(略)	(略)	五 測定機 器	イ～タ (略) <u>レ</u> 動的粘弾性測定装置	(略)	(略)
	<u>レ</u> ファリノグラフ	一時間	一三〇円		<u>ソ</u> ファリノグラフ	一時間	一三〇円
	<u>ソ</u> クリープ試験装置	一時間	二五〇円		<u>ソ</u> クリープ試験装置	一時間	二五〇円
	<u>ツ</u> 香気成分測定装置	一時間	三三〇円		<u>ネ</u> 香気成分測定装置	一時間	三三〇円
	<u>ネ</u> 振動式密度計	一時間	二〇〇円		<u>ナ</u> 振動式密度計	一時間	二〇〇円
	<u>ナ</u> アルコールアナライザ	一時間	四八〇円		<u>ラ</u> アルコールアナライザ	一時間	四八〇円
	<u>ラ</u> ビスコアミログラフ	一時間	一四〇円		<u>ム</u> ビスコアミログラフ	一時間	一四〇円
	<u>ム</u> 発酵モニタ	一時間	一〇〇円		<u>ウ</u> 発酵モニタ	一時間	一〇〇円
	<u>ウ</u> 分光測色計	一時間	一五〇円		<u>ヰ</u> 分光測色計	一時間	一五〇円
	<u>ヰ</u> 光電光沢計	一時間	五〇円		<u>ノ</u> 光電光沢計	一時間	五〇円
	<u>ノ</u> 味覚センサ	一時間	四、三〇〇円		<u>オ</u> 味覚センサ	一時間	四、三〇〇円
六 試料調 製機器	イ～カ (略) <u>(削る)</u>	(略)	(略)	六 試料調 製機器	イ～カ (略) <u>ヨ</u> かくはん機	(略)	(略)
	<u>ヨ</u> 分離用小型超遠心機	一時間	二七〇円		<u>タ</u> 分離用小型超遠心機	一時間	二七〇円
	<u>タ</u> 真空凍結乾燥機	一時間	四二〇円		<u>レ</u> 真空凍結乾燥機	一時間	四二〇円
	<u>レ</u> 食品用乾燥機	一時間	一九〇円		<u>ソ</u> 食品用乾燥機	一時間	一九〇円
	<u>ソ</u> 安全キャビネット	一時間	一三〇円		<u>ツ</u> 安全キャビネット	一時間	一三〇円
	<u>ツ</u> ジャーフアメンタ	一時間	一二〇円		<u>ネ</u> ジャーフアメンタ	一時間	一二〇円
	<u>ネ</u> 電気透析装置	一時間	九〇円		<u>ナ</u> 電気透析装置	一時間	九〇円

	<u>カ</u> ファリノグラフ用ミキサ	一時間	九〇円
七～十(略)	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

二～五 (略)

別表第二 (第十五条関係)

一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額
一 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
二 材料試験	イ 強度試験	(1) 一般強度試験	固体試料の強度試験	一試料 一項目	一、二三〇円 (一項目を増すごとに四一〇円を加える。)
			<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>
		立体形状試料の圧縮試験	一試料 一項目	三、一〇〇円	
		(2)～(7) (略)	(略)	(略)	
口 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
ハ 組織試験	(1)～(4) (略)	(略)	(略)	(略)	
		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	
ニ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
ホ 表面処理試験	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	
		(1) 被膜試験 (耐酸、耐アルカリ、密着、	一試料 一項目	九五〇円	

	<u>カ</u> ファリノグラフ用ミキサ	一時間	九〇円
七～十(略)	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

二～五 (略)

別表第二 (第十五条関係)

一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額
一 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
二 材料試験	イ 強度試験	(1) 一般強度試験	固体試料の強度試験	一試料 一項目	一、二三〇円 (一項目を増すごとに四一〇円を加える。)
			<u>シート状試料の強度試験</u>	<u>一試料 一項目</u>	<u>一、〇〇〇円</u>
		立体形状試料の圧縮試験	一試料 一項目	三、一〇〇円	
		(2)～(7) (略)	(略)	(略)	(略)
口 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ハ 組織試験	(1)～(4) (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
		<u>(5) 溶解法による混用率試験</u>	<u>一試料 二種類以内</u>	<u>二、二四〇円 (一種類を増すごとに六六〇円を加える。)</u>	
ニ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ホ 表面処理試験	<u>(1) 膜厚測定</u>		<u>一試料 二層</u>	<u>六〇〇円</u>	
		(2) 被膜試験 (耐酸、耐アルカリ、密着、	一試料 一項目	九五〇円	

	ピンホール)			
	(2) 中性 塩水噴 霧試験	四八時間以 内の試験 九六時間以 内の試験 二四〇時間 以内の試験 四八〇時間 以内の試験 七二〇時間 以内の試験 九六〇時間 以内の試験 九六〇時間 を超える試 験	一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料	一、八六〇円 二、八二〇円 五、六〇〇円 九、五五〇円 一四、一〇〇円 一九、〇〇〇円 二三、八〇〇円
	(3) キヤ ス試験	四八時間以 内の試験 九六時間以 内の試験 九六時間 を超える試 験	一試料 一試料 一試料	二、七九〇円 四、二三〇円 六、五二〇円
	(4) 複合サイクル試験	二四時 間	八、九三〇円 (二四時間まで を増すごとに 四、七三〇円を 加える。)	
三～九(略)	～(略) (略)	(略)	(略)	
備考	(略)			
二	(略)			

	ピンホール)		
(3) 中性 塩水噴 霧試験	四八時間以 内の試験 九六時間以 内の試験 二四〇時間 以内の試験 四八〇時間 以内の試験 七二〇時間 以内の試験 九六〇時間 以内の試験 九六〇時間 を超える試 験	一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料 一試料	一、八六〇円 二、八二〇円 五、六〇〇円 九、五五〇円 一四、一〇〇円 一九、〇〇〇円 二三、八〇〇円
(4) キャ ス試験	四八時間以 内の試験 九六時間以 内の試験 九六時間を 超える試験	一試料 一試料 一試料	二、七九〇円 四、二三〇円 六、五二〇円
(5) 複合サイクル試験	二四時 間		八、九三〇円 (二四時間まで を増すごとに 四、七三〇円を 加える。)
～(略)	(略)	(略)	(略)
三～九(略)	(略)	(略)	(略)

## 埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例 新旧対照表

(傍線の部分は、改正部分)

## 第二条関係

改 正 後				改 正 前			
埼玉県産業技術総合センター条例				埼玉県産業技術総合センター条例			
第一条～第十八条 (略)				第一条～第十八条 (略)			
別表第一 (第十五条関係)				別表第一 (第十五条関係)			
一 試験研究機器				一 試験研究機器			
種類	名称	単位	金額	種類	名称	単位	金額
一 設計・加工機器	イ～タ (略)	(略)	(略)	一 設計・加工機器	イ～タ (略)	(略)	(略)
	レ レーザー加工機	一時間	二、六一〇円		(新設)	(新設)	(新設)
	ツ インクジェット式積層造形装置	一時間	一、四三〇円		レ インクジェット式積層造形装置	一時間	一、四三〇円
	ツ インクジェット式カラー積層造形装置	一時間	二、八六〇円		ツ インクジェット式カラー積層造形装置	一時間	二、八六〇円
	ネ 金属3Dプリンタ	一時間 (造形装置に係る部分)	二、四三〇円		ツ 金属3Dプリンタ	一時間 (造形装置に係る部分)	二、四三〇円
		一時間 (脱脂装置に係る部分)	四八〇円			一時間 (脱脂装置に係る部分)	四八〇円
		一時間 (焼結装置に係る部分)	七〇〇円			一時間 (焼結装置に係る部分)	七〇〇円
	ナ 角形シートマシン	一時間	二四〇円		ネ 角形シートマシン	一時間	二四〇円
	ラ 製麵機	一時間	一〇〇円		ナ 製麵機	一時間	一〇〇円
	ム 油圧式圧搾機	一時間	九〇円		ラ 油圧式圧搾機	一時間	九〇円
二～三(略)	(略)	(略)	(略)	二～三(略)	(略)	(略)	(略)
四 精密測	イ～ヘ (略)	(略)	(略)	四 精密測	イ～ヘ (略)	(略)	(略)

定機器	ト 真円度測定機	一時間	<u>六三〇円</u>
	チ～ヲ (略)	(略)	(略)
五～六(略)	(略)	(略)	(略)
七 電気・電子測定機器	イ～ハ (略)	(略)	(略)
	<u>ニ エミッショントリバブルシステム</u>	<u>一時間</u>	<u>三、一七〇円</u>
	<u>ホ リバブルチャンバー</u>	一時間	六、九一〇円
	一		
	<u>ヘ 空間電磁界可視化システム</u>	一時間	六六〇円
	<u>ト 電磁波妨害源探査装置</u>	一時間	二九〇円
	<u>チ 電磁波解析装置</u>	一時間	一四〇円
	<u>リ シールド材特性評価装置</u>	一時間	一〇〇円
	<u>ヌ ネットワークアナライザ</u>	一時間	二二〇円
	<u>ル マイクロ波ネットワークアナライザ測定システム</u>	一時間	三、〇八〇円
	<u>ヲ スペクトルアナライザ</u>	一時間	一三〇円
	<u>ワ 広帯域オシロスコープ</u>	一時間	二一〇円
	<u>カ オシロスコープ</u>	一時間	五〇円
	<u>ヨ 高速信号シリアルアナライザ</u>	一時間	一、三〇〇円
八 評価試験機器	タ 任意波形発生装置	一時間	七〇円
	レ 高周波信号発生器	一時間	五〇円
	ソ 交直流可変電源装置	一時間	一〇〇円
	イ～二 (略)	(略)	(略)
九～十(略)	ホ 冷熱衝撃試験機	一時間	<u>五五〇円</u>
	ヘ～ヨ (略)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

二～五 (略)

#### 別表第二（第十五条関係）

##### 一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額

定機器	ト 真円度測定機	一時間	<u>二七〇円</u>
	チ～ヲ (略)	(略)	(略)
五～六(略)	(略)	(略)	(略)
七 電気・電子測定機器	イ～ハ (略)	(略)	(略)
	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
	<u>三 リバブルチャンバー</u>	一時間	六、九一〇円
	一		
	<u>ホ 空間電磁界可視化システム</u>	一時間	六六〇円
	<u>ヘ 電磁波妨害源探査装置</u>	一時間	二九〇円
	<u>ト 電磁波解析装置</u>	一時間	一四〇円
	<u>チ シールド材特性評価装置</u>	一時間	一〇〇円
	<u>リ ネットワークアナライザ</u>	一時間	二二〇円
	<u>ヌ マイクロ波ネットワークアナライザ測定システム</u>	一時間	三、〇八〇円
	<u>ル スペクトルアナライザ</u>	一時間	一三〇円
	<u>ヲ 広帯域オシロスコープ</u>	一時間	二一〇円
	<u>ワ オシロスコープ</u>	一時間	五〇円
	<u>カ 高速信号シリアルアナライザ</u>	一時間	一、三〇〇円
八 評価試験機器	タ 任意波形発生装置	一時間	七〇円
	レ 高周波信号発生器	一時間	五〇円
	ソ 交直流可変電源装置	一時間	一〇〇円
	イ～二 (略)	(略)	(略)
九～十(略)	ホ 冷熱衝撃試験機	一時間	<u>四四〇円</u>
	ヘ～ヨ (略)	(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

二～五 (略)

#### 別表第二（第十五条関係）

##### 一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額

一 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
二 材料試験	イ～二 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	木 表面 処理試 験	(1)～(2) (略)		(略)	(略)
		(3) キヤ ス試験	<u>削る</u>	<u>一試料</u> <u>(二四 時間以 内)</u>	<u>三、七三〇円</u> <u>(二四時間まで を増すごとに 二、五九〇円を 加える。)</u>
			<u>削る</u>	<u>削る</u>	<u>削る</u>
			<u>削る</u>	<u>削る</u>	<u>削る</u>
		(4) (略)		(略)	(略)
	△ (略)	(略)		(略)	(略)
	三 測定及 び検査	イ 精密 測定	(1)～(3) (略)	(略)	(略)
			(4) 真円度測定		一試料 一測定
		ロ EM C測定	(5)～(9) (略)		(略)
			(1)～(3) (略)		(略)
			(4) エミッショ ン測定 システムによる測定		一時間
			(5) リバブレーシ ョン チャンバーを使用す る測定		一時間
			(6) 電磁波妨害源探査		一時間

一 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
二 材料試 験	イ～二 (略)	(略)	(略)	(略)
	木 表面 処理試 験	(1)～(2) (略)		(略)
		(3) キヤ ス試験	<u>四八時間以 内の試験</u>	<u>一試料</u> <u>二、七九〇円</u>
			<u>九六時間以 内の試験</u>	<u>一試料</u> <u>四、二三〇円</u>
			<u>九六時間を 超える試験</u>	<u>一試料</u> <u>六、五二〇円</u>
		(4) (略)		(略)
	△ (略)	(略)		(略)
	三 測定及 び検査	イ 精密 測定	(1)～(3) (略)	(略)
			(4) 真円度測定	
		ロ EM C測定	(5)～(9) (略)	
			(1)～(3) (略)	
			(4) エミッショ ン測定 システムによる測定	
			(5) リバブレーシ ョン チャンバーを使用す る測定	
			(6) 電磁波妨害源探査	

		装置による測定		時間を増すごとに三、〇八〇円を加える。)			装置による測定		時間を増すごとに三、〇八〇円を加える。)
	ハ (略)	(略)	(略)	(略)		ハ (略)	(略)	(略)	(略)
四 環境試験	<u>イ 衝撃試験装置による試験</u>			一試料	一三、八〇〇円	四 環境試験	<u>衝撃試験装置による試験</u>		
	<u>ロ 冷熱衝撃試験機による試験</u>			一測定			<u>(新設)</u>		
五～六 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)		五～六 (略)	(略)	(略)	(略)
七 調製	試験片調製	(1)～(4) (略)	(略)	(略)	(略)	七 調製	試験片調製	(1)～(4) (略)	(略)
		(5) 顕微鏡試験片調製	三〇分	<u>二、一七〇円</u>				(5) 顕微鏡試験片調製	<u>七六〇円</u>
		(6)～(7) (略)	(略)	(略)	(略)			(6)～(7) (略)	(略)
八～九 (略)	(略)	(略)	(略)	(略)		八～九 (略)	(略)	(略)	(略)
備考 (略)						備考 (略)			
二 (略)						二 (略)			